## Si(111)基板上 BaSi<sub>2</sub> エピタキシャル膜の双晶粒界に対する第一原理計算 First-principle calculations about twin boundaries in BaSi<sub>2</sub> epitaxial film on Si(111) <sup>1</sup>筑波大院 数理<sup>2</sup>産総研電池技術<sup>3</sup>JST-CREST

<sup>°</sup>馬場 正和<sup>1</sup>, 香山 正憲<sup>2</sup>, 都甲 薫<sup>1</sup>, 末益 崇<sup>1,3</sup> <sup>1</sup>Univ. Tsukuba, <sup>2</sup>AIST, <sup>3</sup>JST-CREST, <sup>°</sup>M. Baba<sup>1</sup>, M. Kohyama<sup>2</sup>, K. Toko<sup>1</sup>, and T. Suemasu<sup>1,3</sup> E-mail:bk200711114@s.bk.tsukuba.ac.jp

【背景・目的】

BaSi<sub>2</sub>はSi(111)基板上に a 軸配向成長し、互いに 120°の面内回転関係を持つ3回対称のドメインを形成する [1]。また、バンドギャップ 1.3 eV, 光吸収係数が 3×10<sup>4</sup> cm<sup>-1</sup> (@ 1.5 eV の光子)の特徴から薄膜太陽電池材料への応用が期待できる[2]。BaSi<sub>2</sub>のドメイン粒径は 200 mn 程度と小さく、膜中に、(011)面に平行な結晶面により構成される多くのドメイン粒界(DB)が含まれることが明らかとされている[3]。しかしながら、少数キャリア 拡散長は 9.4 μm と粒径に比べて大きく、粒界において少数キャリアがトラップされていないことが考えられる[3]。本研究では、第一原理計算を用いた理論的視点から DB の構造、少数キャリアに対する特性を検討した。

【実験】

界面エネルギー計算には PAW 法と GGA を含む、Vienna Ab initio Simulation Package (VASP)を用いた[4-6]。 BaSi<sub>2</sub>の双晶粒界には、界面を挟んで向き合う Si 四面体同士の位置関係を考えると、微小な界面方向への変化 を除き、図1のように大きく4つのパターンが考えられる。ここで、A1, A2, B1, B2 はそれぞれ Si 四面体を示 している。BaSi<sub>2</sub>中の Si<sup>(0)</sup>原子座標と、Si<sup>(0)</sup>, Si<sup>(10)</sup>で構成される二等辺三角形に対する位置によって、図2のよ うに4つに分類できる。本研究では図1の4つのモデルについて、界面エネルギーを算出し、エネルギーの大 きさから最安定構造を検討した。k 点メッシュ密度は6×4×2を用い、基底ベクトルに関するカットオフエネ ルギーは 360 eV とした[7]。結晶構造描画には VESTA を使用した[8]。



【結果】

図1の界面構造について界面エネルギーを算出したところ、図1(c)の界面構造において最小の界面エネルギー95 mJ/m<sup>2</sup>が得られた。図1の4つのSi四面体配列に着目すると、図1(c)の構造は粒界面を挟んでSi四面体の配列がバルク結晶内と同様の配列となっている。そのため、Si四面体の位置関係が界面の安定性を支配していると考えられる。図3に示す、平面TEMにより観察された双晶粒界と、a 軸から見た際の構造緩和後の界面モデルのBa原子配列は一貫性がとれており、BaSi<sub>2</sub>の双晶粒界は図3(b)の界面構造であると考えられる。この図3(b)の界面モデルにおいて、粒界近傍とバルク結晶内部の各原子における局所状態密度に顕著な変化は見られなかった。そのため、BaSi<sub>2</sub>の双晶粒界は少数キャリアトラップとして働かないことが考えられる。

- Y. Inomata, T. Nakamura, T. Suemasu, and F. Hasegawa, Japanese Journal of Applied Physics 43 No. 4A (2004) L478.
- [2] K. Toh, T. Saito, and T. Suemasu, Japanese Journal of Applied Physics 50 (2011) 068001.
- [3] M. Baba, K. Toh, K. Toko, N. Saito, N. Yoshizawa, K. Jiptner, T. Sekiguchi, K. O. Hara, N. Usami, and T. Suemasu, Journal of Crystal Growth 348 (2012) 75.
- [4] G. Kresse, and D. Joubert, Physical Review B 59 (1999) 1758.
- [5] P. E. Blöchl, Physical Review B 50 (1994) 17953.
- [6] J. P. Perdew, and Y. Wang, Physical Review B 45 (1992) 13244.

[7] H. J. Monkhorst and J. D. Pack, Physical Review B 13 (1976) 5188.[8] K. Momma, and F. Izumi, Journal of Applied Crystallography 44 (2011) 1272.

